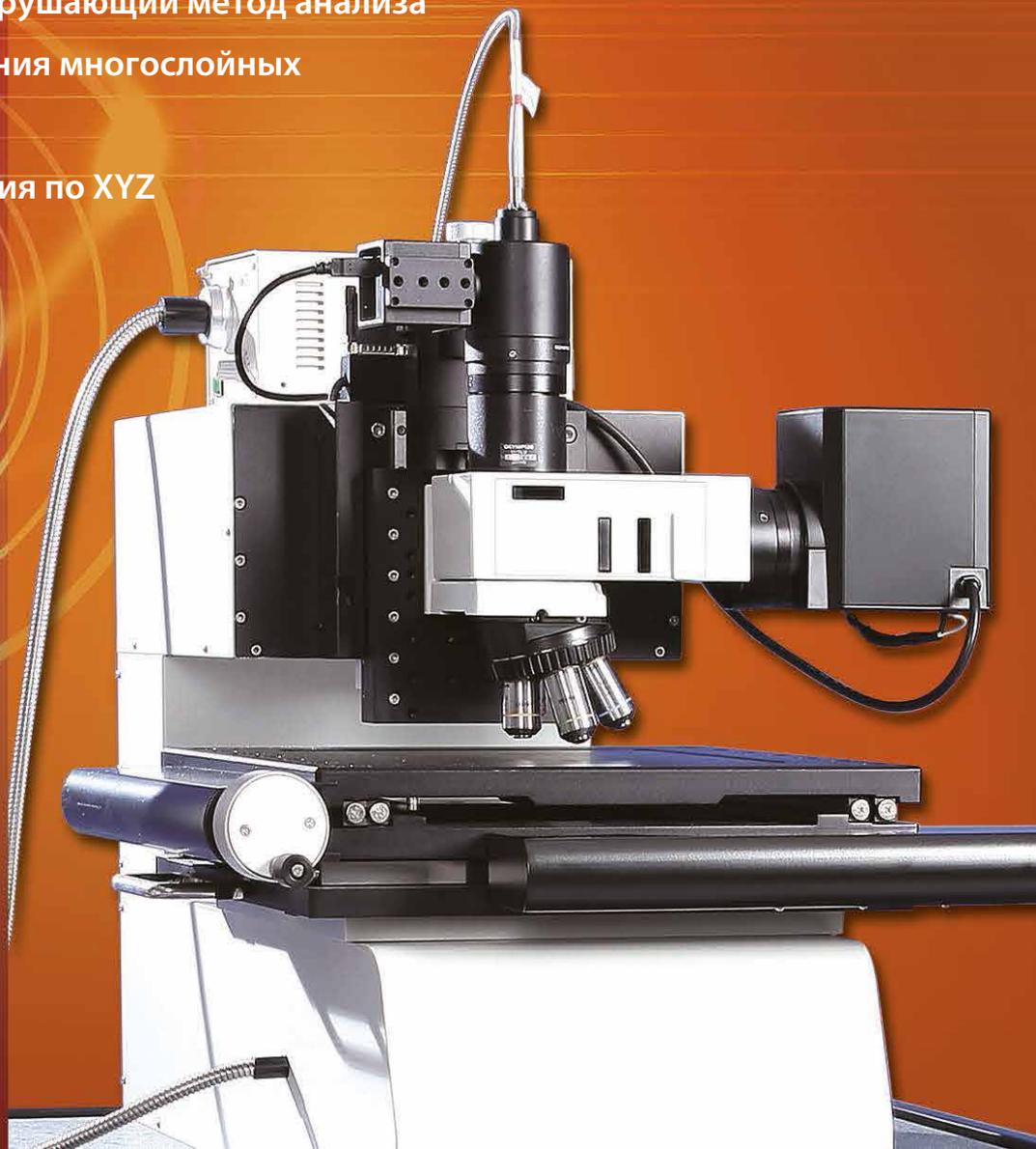


Elli-RSc

Спектроскопический микрорефлектометр

Спектральная рефлектометрия (SR) является надежным, быстрым и точным методом для анализа толщины пленки и оценки ее отражательной способности. Elli-RSc имеет очень маленький диаметр измерительного пятна, что может использоваться для анализа больших образцов с мелкой гетерогенной структурой для определения характеристик различных материалов (например, диэлектриков, полупроводников, органических веществ и т. д.).

- Простота и высокая скорость измерений
- Высокая воспроизводимость анализа
- Бесконтактный неразрушающий метод анализа
- Возможность измерения многослойных материалов
- Контроль перемещения по XYZ



GLOBAL

DIGITAL

Eli-RSc

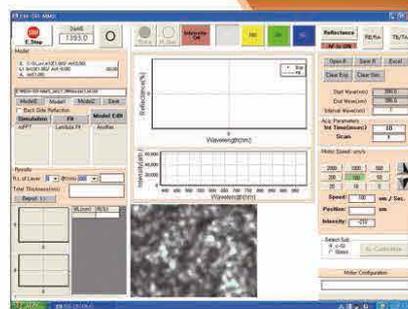
ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Измеряемые параметры: Толщина пленки, отражательная способность
- Диапазон толщин: от 10 нм до 50 мкм (зависит от типа пленки)
- Рабочий спектральный диапазон: 450 – 900 нм
- Скорость анализа: 1 сек/точка (зависит от типа пленки)
- Диаметр измерительного пятна: 50 мкм, 30 мкм, 10 мкм
- Количество анализируемых слоев: до 3 слоев (зависит от типа пленки)
- Воспроизводимость (3σ): ± 0.1 нм на 10 измерений
- Размер предметного столика: 140 × 130 мм
- Диапазон перемещений: 100 × 100 мм



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Определение толщины тонких пленок диэлектриков, полупроводников, полимеров
- Измерение отражательной способности
- Анализ сверхтонких и сверхтолстых пленок
- Измерение толщины подложек: Si, GaAs, Al, стекло, Al_2O_3 , PC, PET и др.



ИЗМЕРЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Полупроводники

Si, SiC, Ge, ONO, ZnO, PR, поликристаллический-Si, GaN, GaAs, Si_3N_4

Дисплеи

MgO, ITO, PR, Alq_3 , CuPc, PVK, PAF, PEDT-PSS, NPB, SiO_2

Диэлектрики

SiO_2 , TiO_2 , Ta_2O_5 , ITO, AlN, ZrO_2 , Si_3N_4 , Ga_2O_3 , влажное окисление

Полимеры

Красители, NPB, MNA, PVA, PET, TAC, PR

Химия

Органические пленки (OLED), тонкие пленки Ленгмюра-Блоджетт

Солнечные элементы

SiN, a-Si, поликристаллический Si, SiO_2

Опции и аксессуары

- Измерение толстых пленок до 300 мкм
- Уменьшенный диаметр измерительного пятна: 4 мкм
- Увеличенные размеры предметного столика: 200 × 200 мм, 300 × 300 мм
- Система автоматической фокусировки с цветной ПЗС-камерой
- Антивибрационная платформа